

当前位置: 科技频道首页 >> 军民两用 >> 新材料与新工艺 >> 一种检测GaN基材料局域光学厚度均匀性的方法

请输入查询关键词

科技频道

搜索

## 一种检测GaN基材料局域光学厚度均匀性的方法

关键词: [均匀性](#) [光学厚度](#) [GaN基材料](#)

所属年份: 2006

成果类型: 应用技术

所处阶段: 中期阶段

成果体现形式: 新材料

知识产权形式: 发明专利

项目合作方式: 其他

成果完成单位: 中国科学院上海技术物理研究所

成果摘要:

该方法是检测GaN基材料局域光学厚度均匀性的方法。采用显微荧光光谱测量,将测得数据进行处理获得振荡干涉谱,再对干涉谱进行干涉峰位线性拟合,进而得到材料的光学厚度,然后用常规的统计方法就可直接得到厚度不均匀性的分布特征。该方法可为材料生长工艺优化研究提供丰富的信息,特别是对严重损害器件质量的局域非均匀性检测方面具有明显的意义。

成果完成人:

[完整信息](#)

行业

管道环:

加氢处:

超级电:

丙烯酸:

库尔勒:

高温蒸:

应用Su:

非临氢:

利用含:

引进PT:

成果

### 推荐成果

- [新型稀土功能材料](#) 04-23
- [低温风洞](#) 04-23
- [大型构件机器缝合复合材料的研制](#) 04-23
- [异型三维编织增减纱理论研究](#) 04-23
- [飞机炭刹车盘粘胶修复技术研究](#) 04-23
- [直升飞机起动用高能量密封免...](#) 04-23
- [天津滨海国际机场预应力混凝...](#) 04-23